

## МНОГООСЦИЛЛАЦИОННЫЕ СПЕКТРЫ ЭЛЕКТРООТРАЖЕНИЯ ГЕРМАНИЯ

И.Г.Неизвестный, Н.Н.Овсяк, М.П.Синюков

Показано, что при создании неравновесного обеднения в области пространственного заряда в полупроводнике можно повысить степень однородности электрического поля при записи спектров электроотражения и наблюдать достаточно большое количество осцилляций для обнаружения эффектов непарараболичности зон.

Пространственная неоднородность поля в полупроводнике на глубине проникновения света может привести к полному затуханию франц-кельышевских осцилляций в экспериментальных спектрах электроотражения [1, 2]. Чтобы исключить эту неоднородность необходимо выполнить критерий [3]:

$$\frac{R_1}{|2k|} \ll 1,$$

где  $R_1 = \left| \frac{1}{\xi} \frac{d\xi}{dz} \right|_{z_s}$  – относительный градиент напряженности электрического поля,  $1/|2k| = \lambda/4\pi\sqrt{n^2 + k^2}$  – эффективная глубина проникновения света,  $z$  – координата вглубь полупроводника ( $z_s$  – ее значение на поверхности), который требует создания условий для получения минимальной величины  $R_1$ . Эта величина будет уменьшаться при увеличении глубины проникновения поля в полупроводник, т. е. модуляцию поверхностного поля при записи спектра необходимо производить в сторону обеднения в области пространственного заряда (ОПЗ). Для получения однородных спектров электроотражения (ЭО) при большой напряженности поля и обеднения в ОПЗ Хандлер с сотрудниками [4] использовал примесные образцы. Им удалось впервые наблюдать три дополнительных осцилляции в спектре ЭО на фундаментальном краю поглощения германия электролитическим методом. При сравнении с теорией оказалось, что экспе-

риментальный спектр может быть хорошо описан с использованием постоянных межзонных приведенных масс. Известно, что при увеличении дефицита энергии фотона  $|E_g - \hbar\omega|$  до величины порядка спин-орбитального расщепления, должны сказываться эффекты непарараболичности зон. Однако, авторам [4] не удалось получить достаточно большого количества осцилляций для наблюдения этих эффектов. В более поздних работах [5], с использованием шотткиевского барьера также не были выполнены оптимальные условия для получения высокой однородности поля. В связи с этим представляет интерес получение спектров ЭО с большим количеством осцилляций, заполняющих энергетический промежуток от  $E_o$  до  $E_o + \Delta_o$ , чему и посвящено настоящее сообщение.

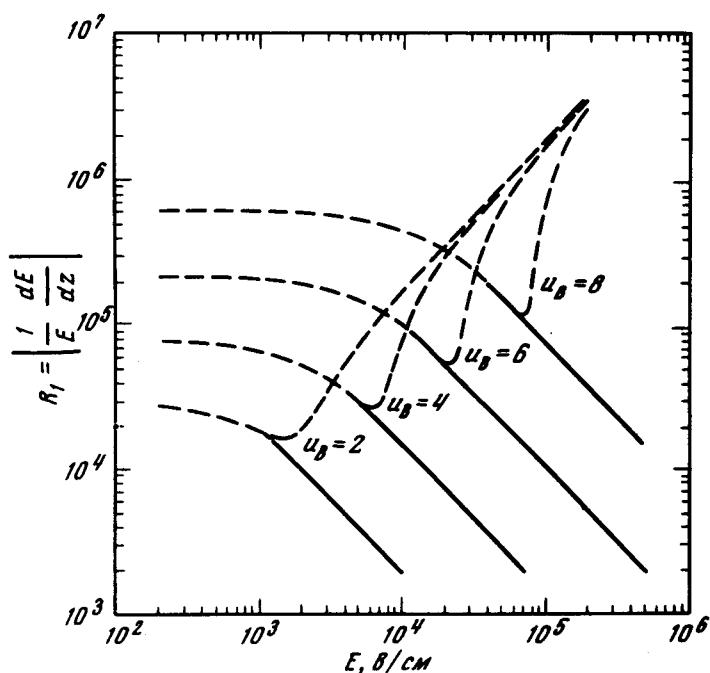


Рис. 1. Зависимость параметра неоднородности  $R_1$  от величины поверхностного поля для разных уровней легирования образца, определяемых объемным потенциалом  $U_B$ . Сплошные линии – неравновесный случай в ОПЗ, пунктирные – равновесный

Зависимость параметра неоднородности  $R_1$  от электрического поля при разных уровнях легирования образца в условиях равновесия в ОПЗ была рассчитана в [3]. Эта зависимость показана пунктирными линиями на рис. 1. Видно, что  $R_1$  достигает минимума при определенном значении напряженности поля для каждого уровня легирования. Последующее возрастание  $R_1$  с увеличением поля обусловлено образованием слоя инверсии в ОПЗ. Избежать этого можно, создав неравновесное обеднение вблизи поверхности. Случай неравновесного обеднения может быть реализован в структурах металл – диэлектрик – полупроводник при высоких частотах модуляции ( $> 10^4$  Гц) или в структурах ме-

талл – полупроводник (барьер Шоттки), когда неосновные носители не накапливаются в ОПЗ. В некоторых случаях эта ситуация будет осуществляться в системах электролит – полупроводник. Использование барьера Шоттки для записи "однородных" спектров ЭО кажется более предпочтительным, потому что флуктуации потенциала, определяемые флуктуациями поверхностного заряда в структурах МДП, будут проявляться в барьерах Шоттки в существенно меньшей степени из-за экранирующего действия металлической поверхности.

В случае барьера Шоттки поле затухает вглубь полупроводника по закону

$$\xi(z) = \xi(z_s) \left(1 + \frac{z}{W}\right),$$

где  $W = \epsilon_0 \epsilon \xi(z_s) / q n_0$  – толщина слоя обеднения,  $\epsilon_0$  и  $\epsilon$  – диэлектрические постоянные вакуума и полупроводника, соответственно,  $n_0$  – равновесная концентрация электронов,  $q$  – заряд электрона. Тогда для параметра  $R_1$  получим выражение

$$R_1 = \frac{qn_0}{\xi(z_s) \epsilon_0 \epsilon}.$$

Зависимость  $R_1$  от поля и концентрации в этом случае представлена сплошными линиями на рис. 1, из которого видно, что при увеличении электрического поля в случае шоттковского барьера более однородное возмущение будет реализовываться в более собственном полупроводнике. Оценка, основанная на решении диффузионного уравнения для потока неосновных носителей в ОПЗ, показала, что минимальная концентрация доноров, достаточная для образования барьера Шоттки на германии при комнатной температуре составляет  $\sim 10^{14} \text{ см}^{-3}$ .

На рис. 2 приведен спектр ЭО, полученный на (111) поверхности  $n$ -Ge с концентрацией  $N_d = 1,3 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$ . В спектре видны три нерегулярности амплитуды осциллирующей части. Эти биения возникают из-за сложения осцилляций, обусловленных зонами легких и тяжелых дырок [4].

Пунктирная линия представляет алгебраическую сумму двух электрооптических функций  $G(\eta_l)$  и  $G(\eta_h)$  для зон легких и тяжелых дырок, соответственно

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{A}{\hbar \omega^2} [BG(\eta_l) + G(\eta_h)],$$

где  $A$  – амплитудный множитель,  $B$  – отношение вкладов легких и тяжелых дырок,  $\eta$  – безразмерный параметр, включающий приведенные массы в направлении поля. Эти массы были выбраны в соответствии с [6] и равняются  $\mu_l = 0,0196 m_e$ ,  $\mu_h = 0,0354 m_e$ ,  $m_e = 0,038 m_o$ ,  $m_o$  – масса свободного электрона. Этот теоретический спектр, вероятно, не будет точной подгонкой вблизи центра зоны Бриллюэна (в области максимума  $E_o$ ) из-за эффектов вырождения и кулоновского взаимодействия. В области 2 – 6-й осцилляций теория совпала с экспериментом, а начиная со второго биения, наблюдается расхождение. Это означает, что экспериментальный спектр нельзя описать полностью, используя постоянные приведенные массы.

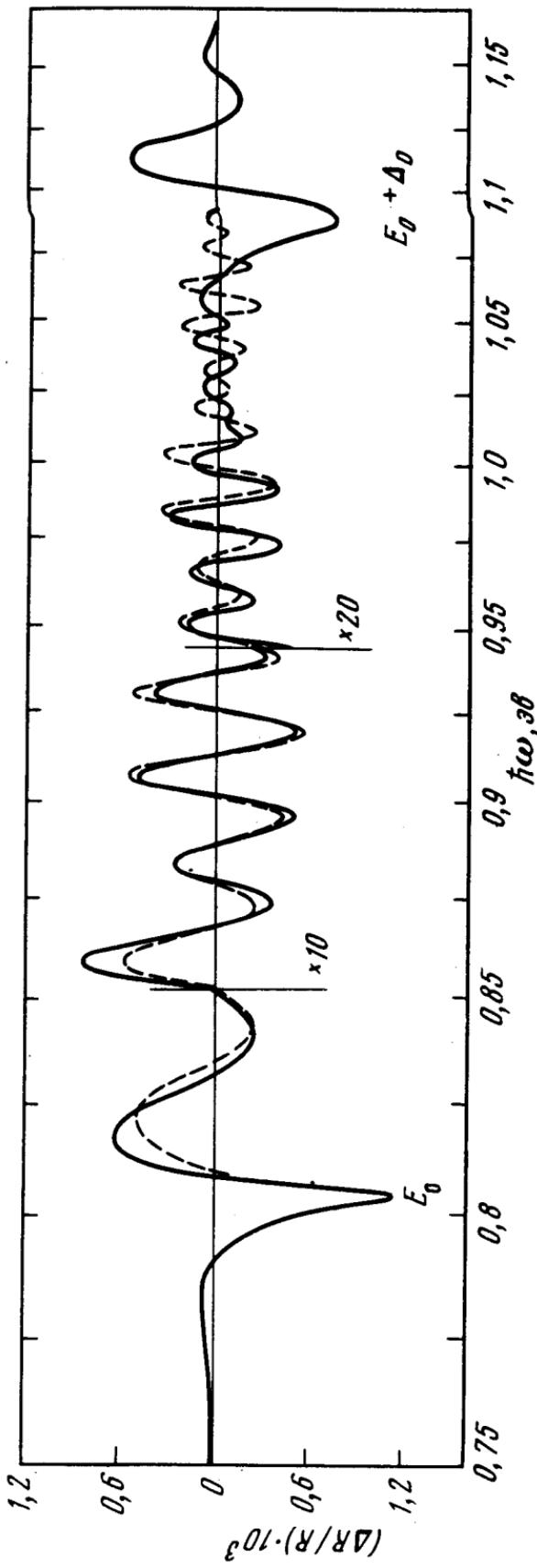


Рис. 2. Сплошная линия — спектр ЭО, полученный на шотткиевском барьере для переходов  $E_0$  и  $E_0 + \Delta_0$  Ge.  $T = 300\text{K}$ ,  $\mathcal{E} = 2,28 \cdot 10^4 \text{ e/cm}$ ,  $\mathcal{E} \parallel [111]$ , вектор поляризации световой волны  $e \parallel [110]$ . Пунктирная линия — теоретический спектр ЭО, полученный с использованием постоянных приведенных масс. Амплитуда этого спектра, начиная с  $0,85 \text{ эВ}$ , увеличена в пять раз. Изменение амплитуды экспериментального спектра показано на рисунке

В области 2 – 3-го биений переходы из зоны тяжелых дырок локализованы в  $\vec{k}$ -пространстве дальше от центра зоны Бриллюэна, чем переходы из зоны легких дырок. Поэтому расхождение эксперимента с теорией обусловлено, скорее всего, изменением приведенной массы для зоны тяжелых дырок. Было найдено, что для совпадения теории с экспериментом новая "непараболическая" приведенная масса должна удовлетворять соотношению

$$\mu_h^* = \mu_h + 0,0735m_0(\hbar\omega - E_g)^2,$$

где  $\mu_h = 0,0354m_0$  – приведенная масса, которая была найдена в приближении параболических зон.

Поступила в редакцию  
15 июля 1976 г.

### Литература

- [1] D.E.Aspnes, A.Frova. Sol. St. Comm., 7, 155, 1969.
- [2] В.А.Тягай. УФЖ, 15, 1164, 1970.
- [3] St. Koeppen, P.Handler. Phys. Rev., 187, 1182, 1969.
- [4] P.Handler. St. Jasperson, St. Koeppen. Phys. Rev. Lett., 23, 1387, 1969.
- [5] D.E.Aspnes. Phys. Rev. Lett., 31, 230, 1973; Phys. Rev., B12, 2297, 1975.
- [6] P.Lawaetz. Phys. Rev., B4, 3640, 1971.